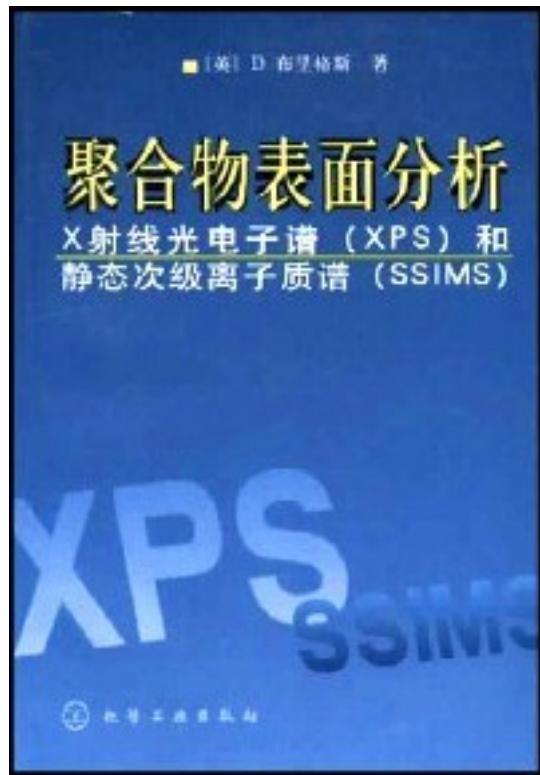


# 聚合物表面分析



[聚合物表面分析 下载链接1](#)

著者:布里格斯

出版者:化学工业出版社

出版时间:2001年1月1日

装帧:平装

isbn:9787502533977

本书深入论述了X射线光电子谱(XPS)和静态次级离子质谱(SSIMS)及其在聚合物材料研究中的应用。在聚合物表面的结构分析与特性研究，特别是解决工业研究中有关问题时，XPS和SSIMS普遍被认为是强有力的技术。随着过去十年仪器分析能力和数据阐释方面的飞速发展，该领域已经发展到有可能将这两方面的信息合并起来的阶段。本书中，作者叙述了XPS和SSIMS技术，并就各自可获得的住处类型分别作了解释。本书也

作者介绍:

## 目录: 第一章 引言

- 1. 1 聚合物表面的重要性
- 1. 2 聚合物表面和体相的差异
- 1. 3 添加剂和污染物的影响
- 1. 4 聚合物表面预处理及改性
- 1. 5 与表面特性有关的深度范围
- 1. 6 聚合物表面分析技术的要求
- 1. 7 XPS简要历史
- 1. 8 SIMS简要历史

## 第二章 X射线光电子谱

- 2. 1 仪器结构
- 2. 2 物理基础

## 第三章 聚合物的XPS信息

• • • • • (收起)

[聚合物表面分析 下载链接1](#)

## 标签

材料学

## 评论

[聚合物表面分析 下载链接1](#)

## 书评

[聚合物表面分析 下载链接1](#)